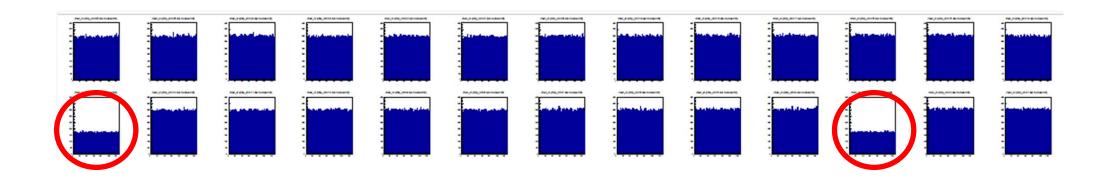
## <u>卒研テーマ</u> ハーフエントリーの解決法 とその妥当性

藤野 雄介

#### 目次

- 1.ハーフエントリーとは
- 2.FPHXチップ
- 3.キャリブレーションテストにおける結果
- 4.Rate dependence の調査
- 5.今後の方針

#### ハーフエントリーとは



このグラフは横軸channel のヒストグラムである。

検出される信号の数が他のchipと比較し、ちょうど半分に減少すること ⇒ キャリブレーションにおいてある程度検出される信号の数は決まっている のでハーフエントリーと判断できる

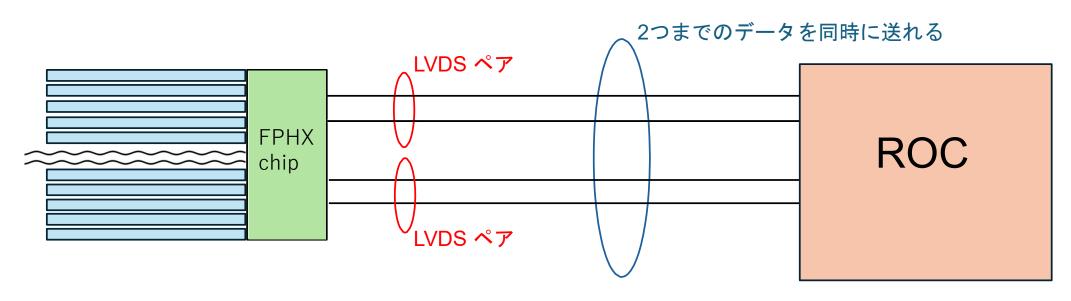
• Chipに放射線が入射するとアナログ信号を生み出し、それが chip毎に取り付けられているFPHX chipによってデジタル信号 に変えられ、4本のケーブルを用いてROCへ送られる。



Channel × 128

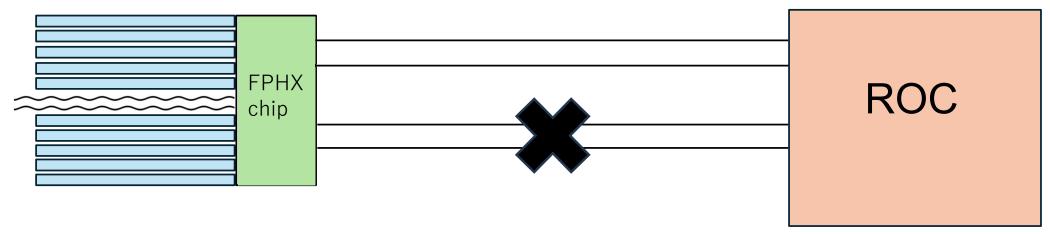
参照:菊池さん 4

• 1つのデータを2本のケーブルで送っている、という事は1つ の FPHX chipは2つまでのデータを同時にROCに送れるとい う事になる。



参照:菊池さん 5

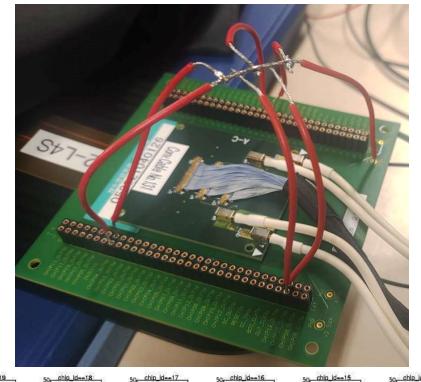
- 読み出しチップに搭載されている2セットの出力信号線のうち 1セットが断線しています。
   ⇒インターセプションボードを用いて同様の現象が確認できる
- FPHX チップの機能の1つにDigital Control という機能がある

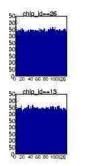


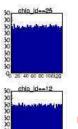
Interception board という転送ラインを断線状態にできるものを用いる。

これを使用すると、実際にハーフエント リーの再現ができる

下図ではchip 11 の片方の転送ラインを断線状態にさせた。

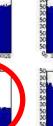


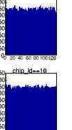


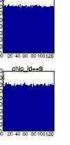


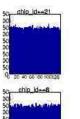


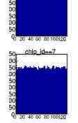


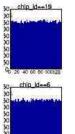


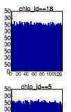


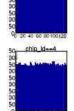




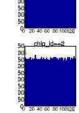


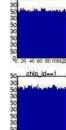












#### **Digital Control**

- <u>**Bit 0**</u>: Active Serial Lines ⇒片方のデータを両方のSerialOut Line に転送するか否か
- Bit 1: Accept ⇒シリコンセンサーからのhit を転送するか否か
- Bit 2 : Global Inject Enable ⇒キャリブレーションのテストパルスを転送するか否か
- <u>**Bit 3**</u>: Serial Output Order ⇒どちらのSerialOut Line に転送するのか

Digital Control のパラメータ

Default: 0111=7

今回使用するパラメータ:<u>0</u>11<u>0</u>=6 or <u>1</u>11<u>0</u>=14

### **Digital** Control: Bit0

- このFIFOに一時的に保存されたデータ群が2ペア の ケーブルを用いて2つ同時に転送されていく。
- 片方のデータが両方の出カラインに転送される

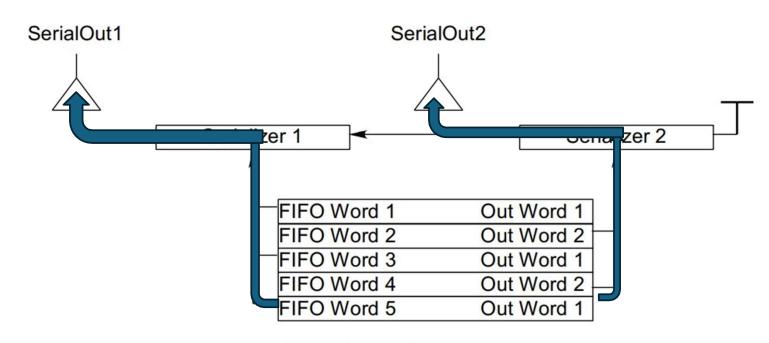
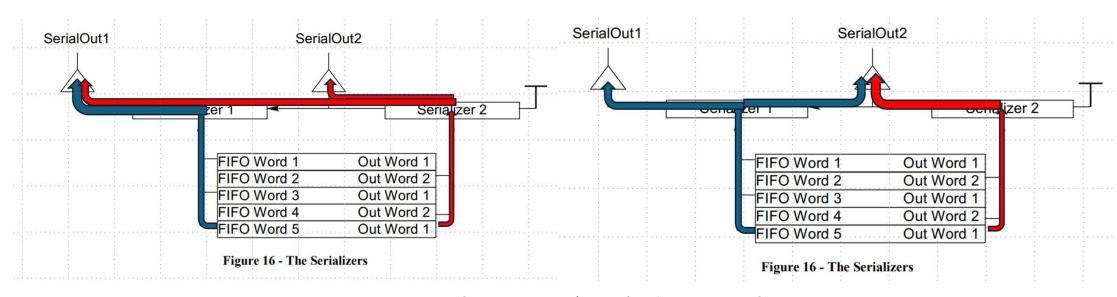


Figure 16 - The Serializers

参照:菊池さん。

# Digital Control: Bit3

- ・これは先ほどのBit0と関係する機能である。
- ・Bit3を変更すると転送ラインを入れ替えることができるのである。

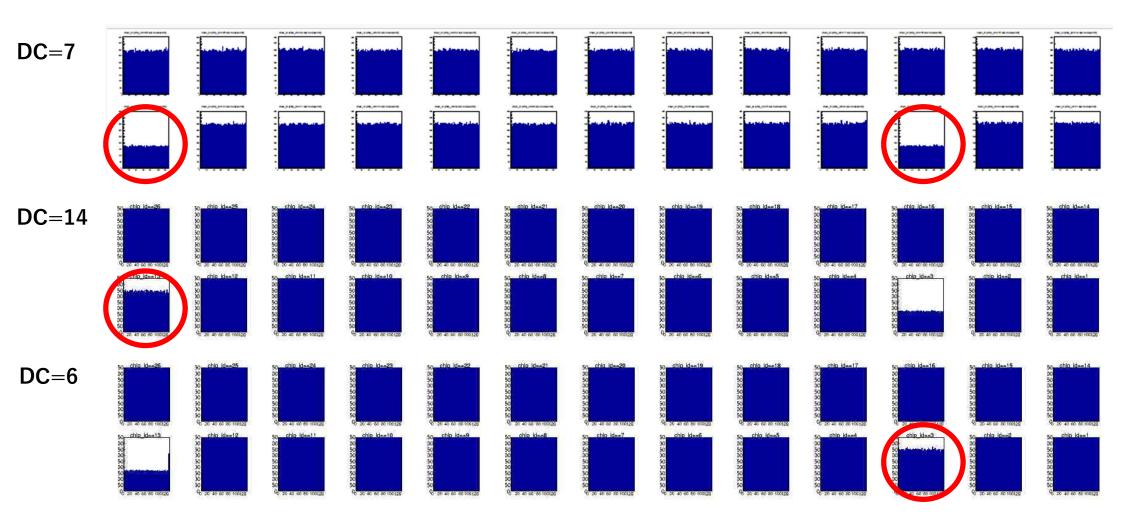


Bit3の変更によるデータ転送ラインの変化

参照:菊池さん 10

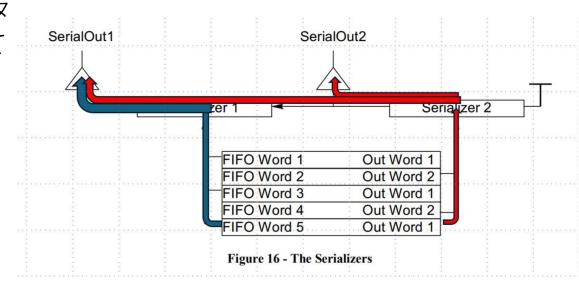
#### Digital Control

テストベンチにおいて、DC の値を変える ことで、ハーフエントリーが復活した



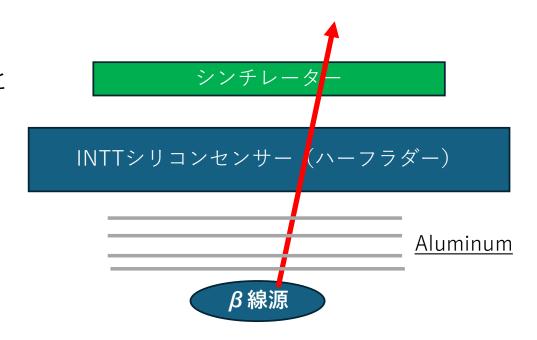
本来2本のラインで送っているデータを1.5倍に複製しているため、入ってくるデータの量が増えてくるとこの機能が使えなくなるのかというのがこれから調べようとしている

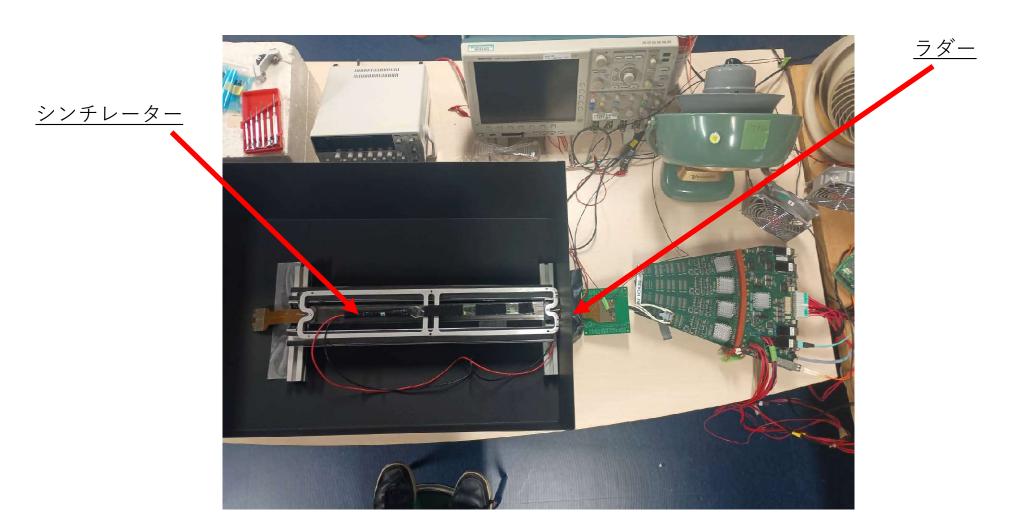
⇒キャリブレーションではなく、シンチレーターを用いた方法でレート 依存性を調べる



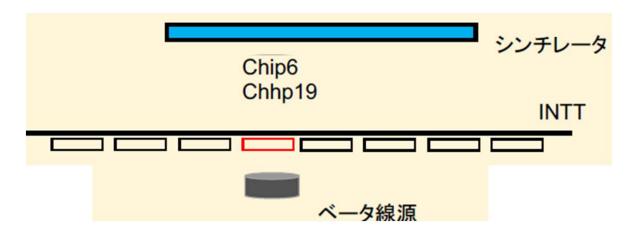
同じタイミングできたときにデータをとるモードを使って検証する アルミニウムを用いて、定量的に レートを調査していく



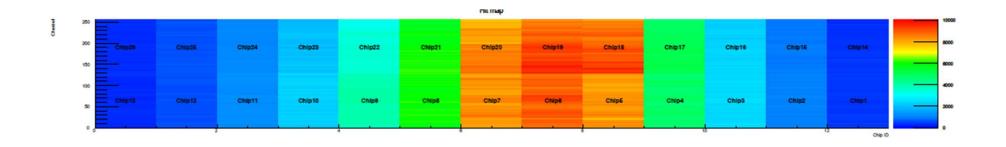




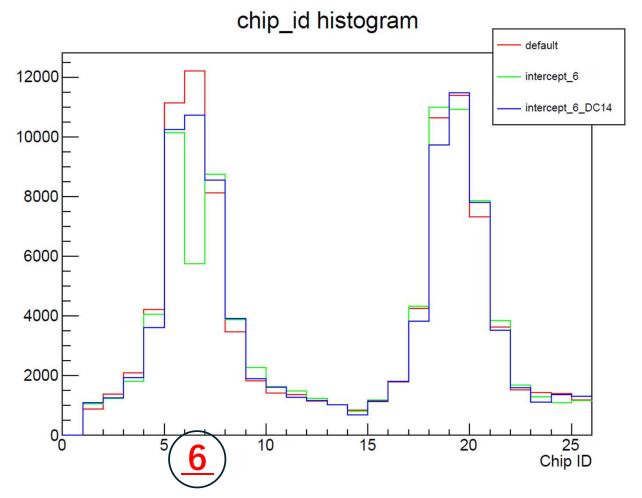
配置方法とHitmap



参照: 2021/11/17 奈良女子大学での活動報告 今井ひかる



Aluminum 240枚(1枚  $12\,\mu$  m)intercept chip6



Aluminum 240枚(1枚 12μm) intercept chip6

補正したChip\_id==6 の エントリー数

Default

┗ 12198(1.93倍)

Intercept

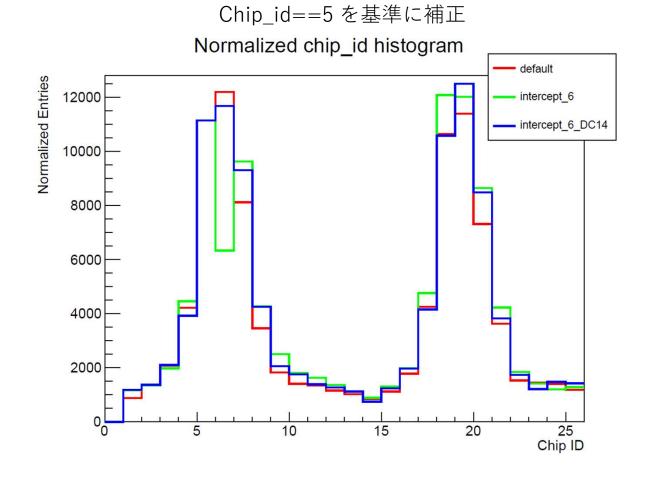
**L** 6328

Intercept & DC=14

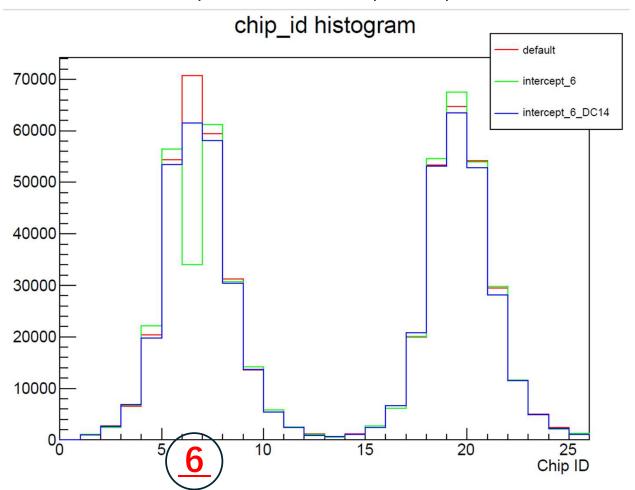
<mark>L 11676(1.85倍)</mark>

30s 測定

389Hz



Aluminum 180枚(1枚 12μm) intercept chip6



Aluminum 180枚(1枚 12μm) intercept chip6

補正したChip\_id==6 の エントリー数

Default

┗ 70669(2.16倍)

Intercept

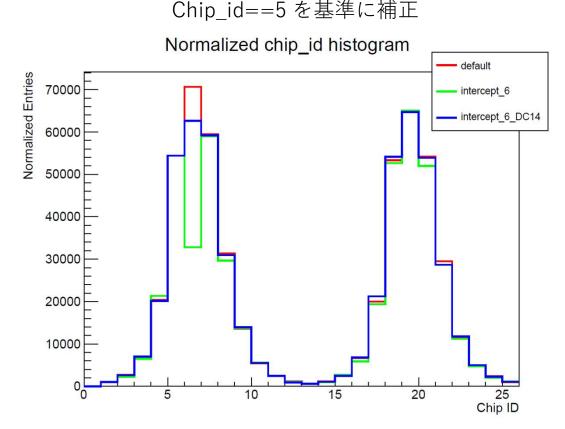
**L** 32790

Intercept & DC=14

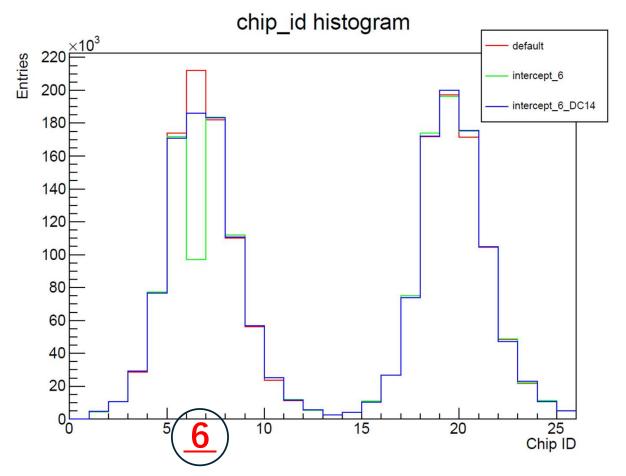
┗ 62649(1.91倍)

30s 測定

2088Hz



Aluminum 120枚(1枚 12μm) intercept chip6



Aluminum 120枚(1枚 12μm) intercept chip6

補正したChip\_id==6 の エントリー数

Default

**L** 211924(2.16倍)

Intercept

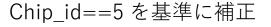
**L** 98310

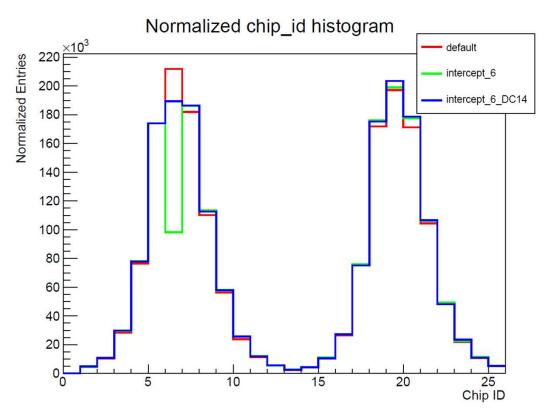
Intercept & DC=14

L <u>189384(1.93倍)</u>

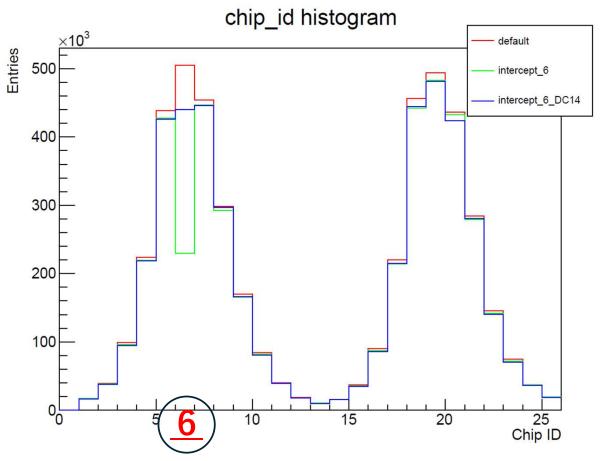
30s 測定

6313Hz





Aluminum 60枚(1枚  $12\,\mu$  m) intercept chip6



Aluminum 60枚(1枚 12μm) intercept chip6

Chip id==5 を基準に補正



Intercept

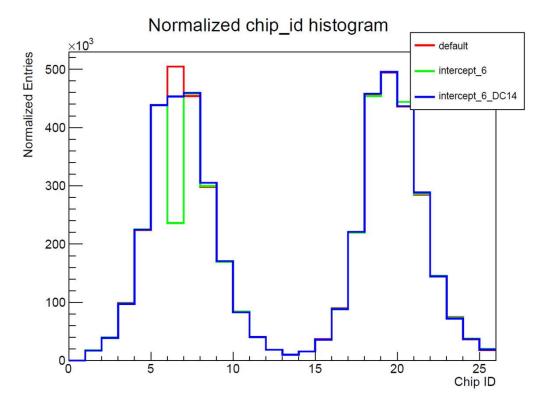
**L** 236010

Intercept & DC=14

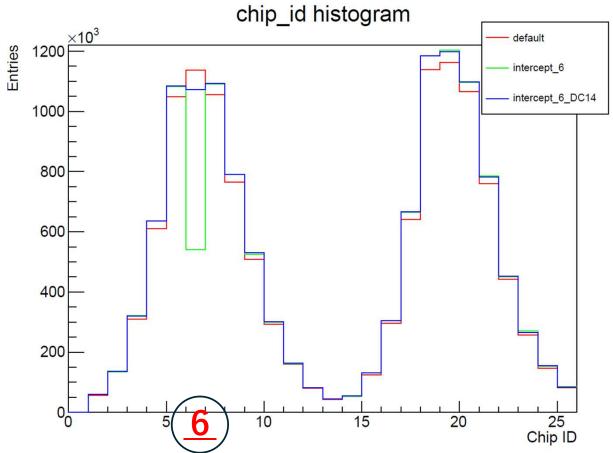
└ 453225(1.92倍)



15108Hz



Aluminum 0枚(1枚 12μm) intercept chip6



Aluminum 0枚(1枚 12μm) intercept chip6

Chip id==5 を基準に補正

補正したChip\_id==6 の エントリー数

Default

**L** 1137010(2.17倍)

Intercept

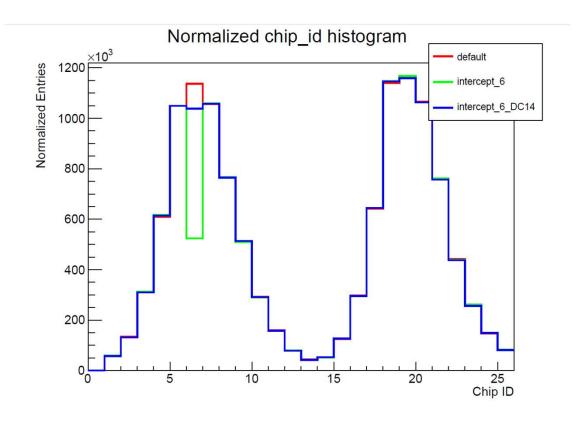
**L** 524237

Intercept & DC=14

└ 1038310(1.98倍)

30s 測定

34610Hz



- アルミとβ線源の透過率を解析する
- 規格化の方法でもっと適切な方法
- DC=6 で復活する方で同じ検証をする

